



DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA ELETTRONICA, INFORMATICA ED ELETTRICA

IEEE LEOS Italy Chapter



AVVISO DI SEMINARIO

Microscopia a stilo: principi e esempi di applicazione

Adele Sassella

**Dipartimento di Scienza dei Materiali
Università di Milano-Bicocca**

Sommario: In questa presentazione si illustreranno brevemente le moderne tecniche di microscopia a stilo, in particolare la microscopia a effetto tunnel (STM) e la microscopia a forza atomica (AFM). Alcuni esempi serviranno a chiarire i principi di funzionamento della tecniche stesse e a mostrare risultati scientifici rilevanti, che rendono questi strumenti importanti anche per la diagnostica di componenti e materiali elettronici.

Lunedì 20 aprile, ore 11 -13, aula E8

I dottorandi e tutti gli altri interessati sono cordialmente invitati.

L'Organizzatore

Prof. Silvano Donati

Il coordinatore del Dottorato

Prof. G Conciauro